




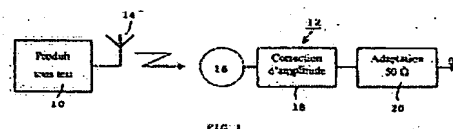


System comprising an apparatus for radiofrequency measurements on an industrial test bench**Veröffentlichungsnummer** EP0955549**Veröffentlichungsdatum:** 1999-11-10**Erfinder** CHAMPANEY PASCAL (FR)**Anmelder:** ADEUNIS R F (FR)**Klassifikation:****- Internationale:** G01R29/08; G01R29/10; H01Q1/24; H04B17/00; G01R29/08; G01R29/10; H01Q1/24; H04B17/00; (IPC1-7): G01R29/08; G01R29/10; H01Q1/24; H04B17/00**- Europäische:** G01R29/08E2; G01R29/10; H01Q1/24A1A1; H04B17/00**Anmeldenummer:** EP19990410065 19990505**Prioritätsnummer(n):** FR19980005905 19980505**Auch veröffentlicht als** FR2778465 (A1) EP0955549 (B1)**Zitierte Dokumente** US5619213 US4220955 US5493702 US5532703 JP62053524

Mehr >>

Datenfehler hier melden**Zusammenfassung von EP0955549**

The unit (12) includes a field proximity sensor (16) mounted on a support close to the transmitting/receiving antenna (14) of the device (10); an amplitude correction circuit (18) for the signal detected by the sensor; an impedance adaptation circuit (20) at the output (24) delivering the test signal (S1).

Daten sind von der esp@cenet Datenbank verfügbar - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 955 549 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
10.11.1999 Bulletin 1999/45

(51) Int Cl.⁶: **G01R 29/08, G01R 29/10,
H01Q 1/24, H04B 17/00**

(21) Numéro de dépôt: **99410065.9**

(22) Date de dépôt: **05.05.1999**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeur: **Champaney, Pascal**
38660 Le Touvet (FR)

(74) Mandataire: **Hecké, Gérard**
Cabinet HECKE
World Trade Center - Europole,
5, Place Robert Schuman,
BP 1537
38025 Grenoble Cedex 1 (FR)

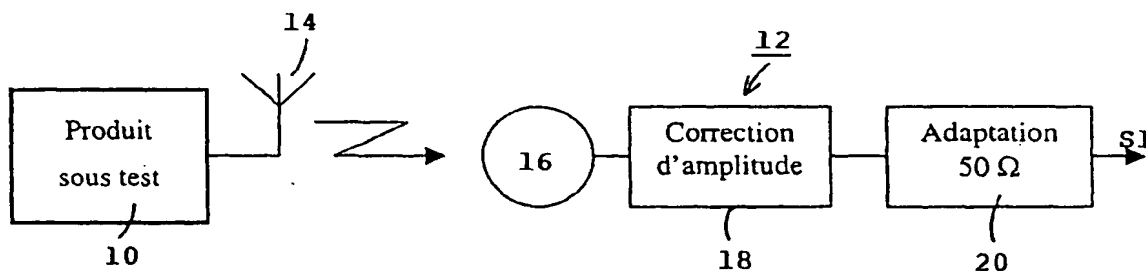
(30) Priorité: **05.05.1998 FR 9805905**

(71) Demandeur: **Adeunis R.F.**
38190 Crolles (FR)

(54) Dispositif de mesure radiofréquence pour un banc de test industriel

(57) Un dispositif de mesure 12 pour le test des signaux radioélectriques émis par un appareil de communication 10 à transmission radio comporte un capteur de champ proche 16 placé à proximité de l'antenne 14 émettrice/réceptrice de l'appareil 10, un circuit de correction d'amplitude 18 du signal détecté par le capteur

16, et un circuit d'adaptation d'impédance 20 à la sortie délivrant le signal de test S1. Le capteur 16 du type magnétique ou électrique, n'est sensible qu'au champ proche émis par l'antenne 14, sans être influencé par des champs parasites de l'environnement extérieur. L'absence de contact galvanique avec l'appareil 10 sous test évite tout risque de faux contact.

**FIG 1**

Description

Domaine technique de l'invention

[0001] L'invention est relative à un dispositif de mesure pour le test des signaux radioélectriques à haute fréquence émis par un appareil de communication à transmission radio utilisé dans le domaine des télécommunications, de la téléphonie mobile, et de la domotique.

Etat de la technique

[0002] Les applications grand public de ce type de matériels engendrent des grandes séries de fabrication, nécessitant en fin de cycle de production des bancs de test destinés à vérifier le bon fonctionnement des appareils. Les bancs de test font usage d'outillages soumis à un grand nombre de manoeuvres, avec comme conséquence l'usure prématurée des pièces mobiles et des contacts de mesure. Les points de mesure servant à prélever les signaux à radiofréquence sont en effet rapidement affectés d'erreurs de mesure. Les signaux sont d'une manière classique prélevés au moyen de sondes ou pointes de mesure coaxiales.

[0003] L'usage de ces contacts mécaniques présentent les inconvénients suivants :

- l'usure prématurée impose un remplacement régulier des pointes et contacts de test en fonction des cadences de fabrication, d'où des frais supplémentaires de maintenance et de contrôle;
- l'agencement coaxial des pointes ne permet pas de garantir la valeur de l'impédance de sortie, laquelle est fondamentale lors de mesures critiques dans les systèmes de modulation de phase;
- le prélèvement des signaux par des contacts mécaniques est impossible sur des appareils ayant une antenne intégrée, où les points de mesure à radiofréquence sont inaccessibles, et ne disposant pas de connecteur externe du côté haute fréquence.

[0004] La vérification est alors limitée au test de la carte électronique par un système de mesure conduite, avec comme inconvénient la prévision d'un budget lié au remplacement fréquent des pointes. La répétabilité du test reste cependant fortement altérée par l'usure progressive des contacts de mesure.

[0005] Dans les documents JP 62 053524 et US-A-5619213, des coupleurs d'antennes sont liés à l'exploitation des émetteurs récepteurs radio mobiles. La fonction essentielle de ces dispositifs est la recherche de la plus faible perte d'insertion possible, de manière à conserver les caractéristiques des émetteurs récepteurs. Le domaine d'application du dispositif de la présente de-

mande se limite au seul test des équipements sur un banc de test traitant des forts volumes de production. Il remplace une prise d'information RF conduite par une mesure en rayonné dans un environnement fortement métallique. L'utilisation d'une antenne à la place d'un capteur à champ proche ne permettrait pas d'obtenir la précision souhaitée. En effet, une antenne est considérée comme étant un capteur de champ lointain, qui serait sensible aux champs parasites existant dans un environnement métallique. Les pertes de transmission avec une antenne sont également supérieures, et la bande de fréquence réduite poserait des problèmes de stabilité et d'ajustage.

Objet de l'invention

[0006] L'objet de l'invention consiste à réaliser un dispositif de mesure sans contact pour tester avec précision les signaux radioélectriques émis par un appareil de communication à haute fréquence, indépendamment de l'environnement extérieur.

[0007] Le dispositif de mesure selon l'invention est caractérisé en ce qu'il comporte :

- un capteur de champ proche monté sur un support à proximité de l'antenne émettrice/réceptrice de l'appareil,
- un circuit de correction d'amplitude du signal détecté par le capteur,
- et un circuit d'adaptation d'impédance à la sortie délivrant le signal de test.

[0008] L'utilisation d'un capteur de champ proche, corrigé en amplitude et adapté en impédance à 50 Ohms, permet de travailler dans un environnement fortement métallique, tout en obtenant des mesures très précises. Un tel système de mesure radiofréquence sans contact augmente la fiabilité et la précision du test, l'absence d'usure évitant les opérations de remplacement qui étaient indispensables avec la technique de l'art antérieur. Les mesures radio sur les modulations numériques imposent en effet une parfaite planéité de la réponse en fréquence quitte à avoir des pertes de transmission importantes, lesquelles sont prises en compte lors de la calibration.

[0009] Selon une caractéristique de l'invention, le capteur de champ proche est formé par un capteur magnétique, notamment en forme de boucle à induction. Le capteur de champ proche peut également être formé par un capteur électrique, notamment du type capacitif en ligne ou en surface.

[0010] Selon une autre caractéristique de l'invention, le circuit de correction d'amplitude est constitué par un réseau passif non résistif comprenant des circuits élémentaires LC agencés entre le capteur et la sortie. Le circuit d'adaptation d'impédance comprend un réseau passif de cellules à composants résistifs ou non résistifs, inséré entre le circuit de correction d'amplitude et

la sortie.

[0011] Un tel dispositif de mesure sans contact par capteur de champ proche est particulièrement adapté pour équiper un banc de test industriel. Le capteur n'est sensible qu'au champ électrique proche de l'antenne de l'appareil, sans aucune influence de champs parasites en provenance du châssis métallique et du câblage électrique des sondes et des pointes de test à basse fréquence.

[0012] D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre d'un mode de réalisation de l'invention, donné à titre d'exemple non limitatif et représenté aux dessins annexés, dans lesquels:

- la figure 1 est une vue synoptique du dispositif de mesure sans contact selon l'invention;
- la figure montre une vue en élévation d'un appareil à tester placé à proximité du dispositif de mesure sans contact;
- la figure 3 représente une vue de profil de la figure 2;
- la figure 4 est une vue schématique en perspective d'un banc de test industriel équipé du dispositif de mesure sans contact selon l'invention.

[0013] Sur les figures 1 à 3, un appareil de communication 10 à transmission radioélectrique à haute fréquence, utilisé dans le domaine des télécommunications, de la téléphonie mobile, ou de la domotique, est testé au moyen d'un dispositif de mesure radiofréquence 12 sans contact, disposé à proximité de l'antenne 14 rayonnante de l'appareil 10 à tester.

[0014] Le dispositif de mesure 12 de l'information à radiofréquence comporte un capteur de champ proche 16 connecté à un circuit de correction d'amplitude 18, et à un circuit d'adaptation d'impédance 20 à 50 Ohms. Le capteur 16 est monté sur un support mécanique 22 s'étendant parallèlement et à faible distance le long de l'antenne 14 émettrice/réceptrice. Le signal de test S1 est prélevé sur une sortie coaxiale 24 du capteur 16 après adaptation de l'impédance, et est transmis vers l'instrumentation grâce à un câble 26 branché à un connecteur 28.

[0015] En fonction des fréquences de travail de l'appareil de communication 10, et de la nature de son antenne 14 rayonnante (fouet, boucle,...), le capteur de champ proche 16 peut être soit magnétique en forme de boucle à induction, soit électrique du type capacitif en ligne ou surface. Dans l'exemple des figures 2 et 3, l'antenne 14 de l'appareil 10 est formée par un fouet à quart d'onde, et la prise d'information à radiofréquence est opérée au moyen d'un capteur 16 en ligne destiné à la détection du champ électrique proche engendré par l'antenne 14 lors de l'émission radioélectrique.

[0016] L'incidence de la nature de l'antenne 14 sur les

caractéristiques du signal de test S1 est nulle suite à l'adaptation d'impédance intégrée. Les pertes de transmission lors de la prise d'information du dispositif de mesure 12 restent inférieures à 15 dB grâce à l'impédance de sortie de 50 Ohms.

[0017] Le circuit de correction d'amplitude 18 est formé par un réseau passif non résistif, par exemple à circuits élémentaires LC, destiné à engendrer une réponse inverse du signal en provenance du capteur 16 pour réaliser ladite correction du signal de test S1. Le circuit d'adaptation d'impédance 20 est constitué par un réseau passif de cellules à composants résistifs ou non résistifs.

[0018] Le test des caractéristiques d'émission radioélectrique de l'appareil 10 s'effectue de la manière suivante :

[0019] Après la mise en service de l'appareil 10 en mode d'émission, le capteur de champ proche 16 est positionné à proximité de l'antenne 14 pour capter les signaux à radiofréquence rayonnés par l'antenne 14. Le capteur 16 n'est sensible qu'au champ proche émis par l'antenne 14, sans être influencé par des champs parasites de l'environnement extérieur. L'absence de contact galvanique avec l'appareil 10 sous test évite tout risque de faux contact. La liaison radioélectrique pour le prélèvement du signal de test S1 évite d'autre part tout contact mécanique avec l'appareil 10, et permet un captage fiable des signaux rayonnés sans usure du capteur 16. L'impédance est adaptée automatiquement à la sortie 24 par le circuit d'adaptation 20, et est figée indépendamment des conditions de mesure.

[0020] Une telle mesure radiofréquence sans contact est particulièrement adaptée pour une production en grande série des appareils 10. Le test peut être opéré directement en fin de cycle de fabrication, sans nécessiter d'interruption de la production pour la maintenance de la prise d'information à radiofréquence. L'absence d'usure du capteur 16 permet des mesures très précises du signal de test S1 à ± 1 dB.

[0021] La figure 4 montre un exemple d'application du dispositif de mesure 12 à un banc de test 30 industriel.

[0022] L'appareil 10 à tester, par exemple un téléphone mobile, est posé à plat sur une platine 32 métallique du châssis 34, avec son antenne 14 orientée latéralement du côté du capteur de champ proche 16 du dispositif de mesure 12. Le banc de test 30 est équipé d'un premier connecteur 36 à pointes pour l'alimentation de l'appareil 10, et d'un deuxième connecteur 38 de prise d'information à basse fréquence destinés à coopérer avec des bornes correspondantes de l'appareil 10. Le capteur 16 n'est sensible qu'au champ électrique proche de l'antenne 14, sans aucune influence de champs parasites en provenance du châssis 34 métallique et du câblage électrique des sondes et des pointes de test à basse fréquence au niveau des connecteurs 36, 38.

Revendications

1. Dispositif de mesure (12) pour le test des signaux radioélectriques à haute fréquence émis par un appareil de communication (10) à transmission radio utilisé dans le domaine des télécommunications, de la téléphonie mobile, et de la domotique, caractérisé en ce qu'il comporte :
 - un capteur de champ proche (16) monté sur un support (22) à proximité de l'antenne (14) émettrice/réceptrice de l'appareil (10),
 - un circuit de correction d'amplitude (18) du signal détecté par le capteur (16),
 - et un circuit d'adaptation d'impédance (20) à la sortie (24) délivrant le signal de test (S1).
2. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le capteur de champ proche (16) est formé par un capteur magnétique, notamment en forme de boucle à induction.
3. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le capteur de champ proche (16) est formé par un capteur électrique, notamment du type capacitif en ligne ou en surface.
4. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit de correction d'amplitude (18) est constitué par un réseau passif non résistif comprenant des circuits élémentaires LC agencés entre le capteur (16), et la sortie (24).
5. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit d'adaptation d'impédance (20) comprend un réseau passif de cellules à composants résistifs ou non résistifs, inséré entre le circuit de correction d'amplitude (18) et la sortie (24).
6. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 5, caractérisé en ce que le signal de test (S1) est prélevé à la sortie (24) du dispositif de mesure (12) au moyen d'un connecteur (28) à accès 50 Ohms.
7. Banc de test industriel (30) pour le test d'appareils de communication en fin de cycle de fabrication, caractérisé en ce qu'il est équipé d'un dispositif de mesure (12) selon l'une des revendications 1 à 6.

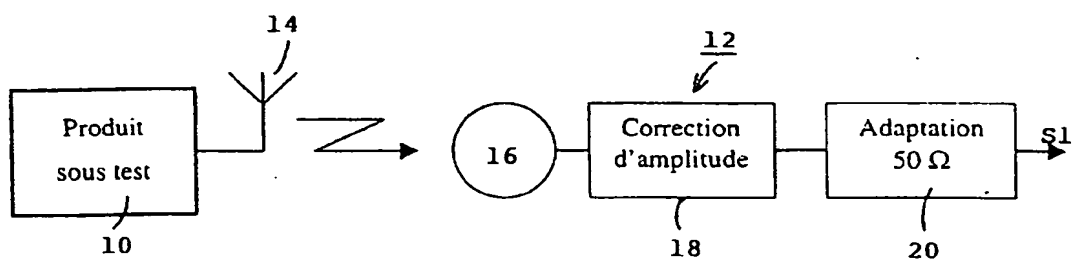


FIG 1

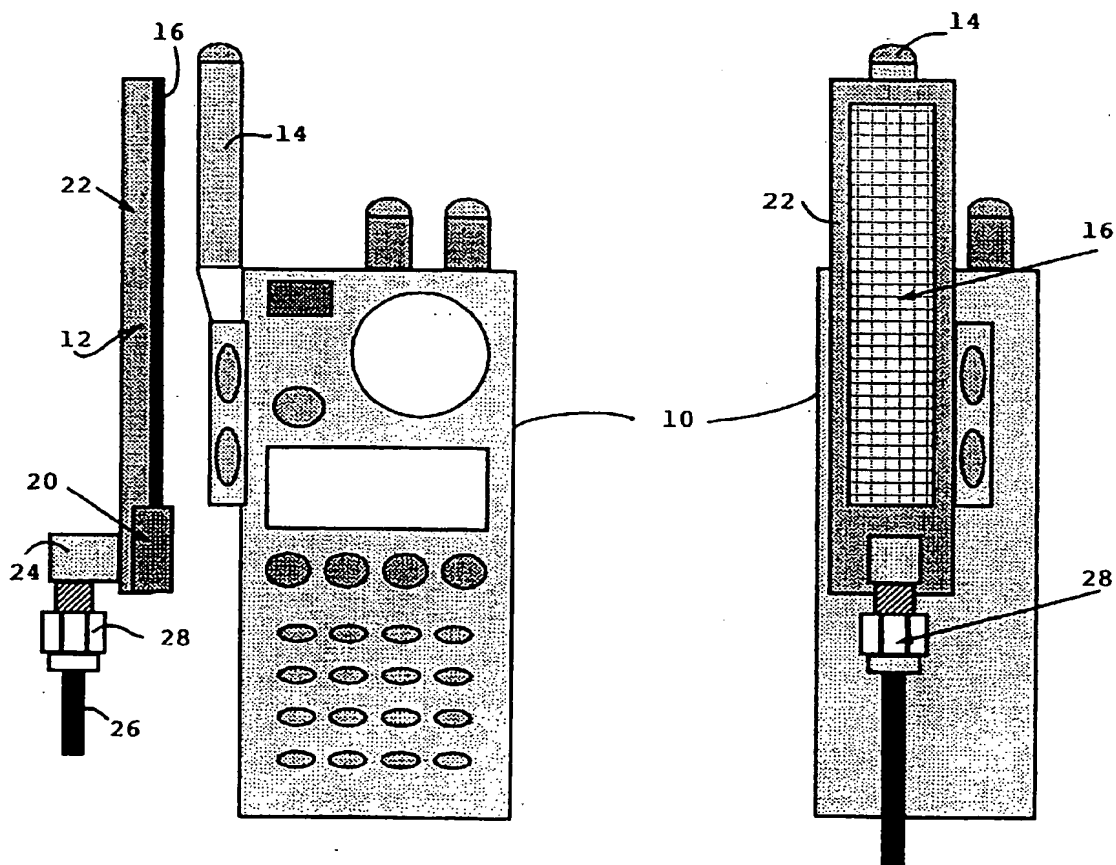


FIG 2

FIG 3

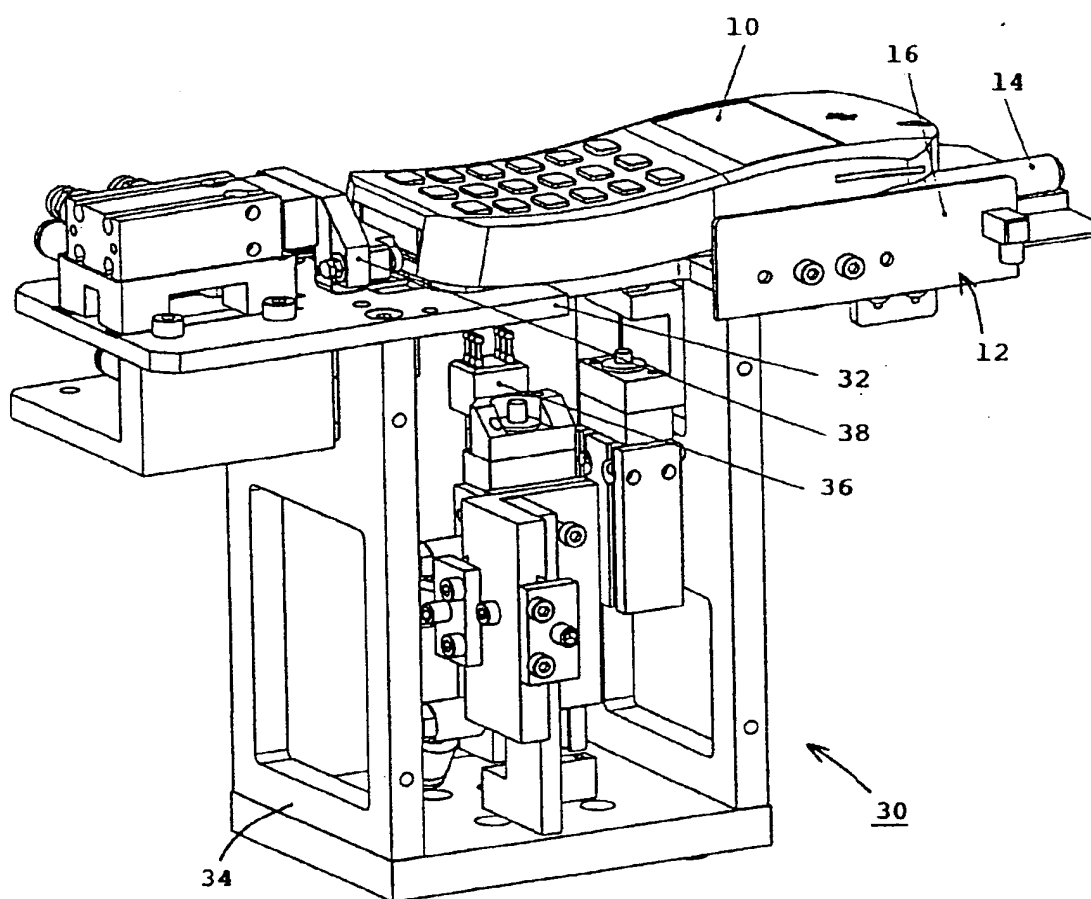


FIG 4



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 41 0065

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
Y	US 5 619 213 A (HAYS III WILLIAM W) 8 avril 1997 * abrégé * * colonne 3, ligne 23 - ligne 25 * * colonne 5, ligne 33 - ligne 36 * * figures * ---	1,2,4-7	G01R29/08 G01R29/10 H01Q1/24 H04B17/00
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 240 (E-529), 6 août 1987 & JP 62 053524 A (SEIKO EPSON CORP), 9 mars 1987 * abrégé *	1,2,4-7	
A	US 4 220 955 A (FRYE EUGENE O) 2 septembre 1980 * abrégé * * colonne 1, ligne 23 - ligne 26 * * colonne 1, ligne 61 - colonne 2, ligne 15 * * colonne 3, ligne 59 - ligne 66 * * figure 1 * ---	1-3,6,7	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 005, 30 avril 1998 & JP 10 002920 A (SAITAMA NIPPON DENKI KK), 6 janvier 1998 * abrégé *	1,7	G01R H01Q H04B
A	US 5 493 702 A (CROWLEY ROBERT J ET AL) 20 février 1996 * colonne 3, ligne 36 - ligne 47 * * figure 1 *	2,3	
A	US 5 532 703 A (STEPHENS GERALD D ET AL) 2 juillet 1996 * colonne 2, ligne 50 - ligne 64 * * figures * ---	2,3	
		-/--	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 23 juin 1999	Examineur Lopez-Carrasco, A
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire	

EPO FORM 1503 03 82 (P04C02)



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 41 0065

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 009, 30 septembre 1997 & JP 09 133724 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 20 mai 1997 * abrégé * -----	1,2,4-7	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 23 juin 1999	Examineur Lopez-Carrasco, A
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-acrité P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03 02 (F4.02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 99 41 0065

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

23-06-1999

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5619213 A	08-04-1997	AU 5093296 A WO 9627916 A	23-09-1996 12-09-1996
US 4220955 A	02-09-1980	AUCUN	
US 5493702 A	20-02-1996	WO 9717792 A US 5711014 A	15-05-1997 20-01-1998
US 5532703 A	02-07-1996	AUCUN	

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No. 2/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)